1日目：6月3日（月）

		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00
A会場	2F 国際会議室																									
B会場	2F 201				9:00～11:30 B-6 細胞～組織～個体					12:00 ～12:50 LS-1 カールツァイス					14:30～17:15 S-01 クライオ電子顕微鏡フロンティア						17:30 ～18:00 OT-2 日本電子					
C会場	3F 301			8:30～11:45 I-1 先端的TEM・STEM・回折法						12:00 ～12:50 LS-2 アメテック					14:30～17:30 I-1 先端的TEM・STEM・回折法										
D会場	3F 302									12:00 ～12:50 LS-3 日本電子					14:30～17:30 M-3 ソフトマテリアル観察・計測										
E会場	3F 303						10:30～11:45 I-5 プローブ顕微鏡法			12:00 ～12:50 LS-4 サーモフィッシャーサイエンティフィック					14:30～16:45 S-02 先端ナノプローブ分析技術とISO国際標準化の進展					17:00 ～17:30 OT-3 サーモフィッシャーサイエンティフィック					
F会場	1F 103				9:15～11:45 I-3 分析顕微鏡法					12:00 ～12:50 LS-5 ブルカージャパン					14:30～17:15 I-4 3次元顕微鏡法										
G会場	1F 104									12:00 ～12:50 LS-6 ライカマイクロシステムズ					14:30～17:15 T-1 電子顕微鏡技術認定委員会チュートリアル										
H会場	1F 105				8:45～11:45 I-6 試料作製技術								13:30～16:30 OT-1 風戸研究奨励会受賞講演							17:00 ～17:30 OT-4 カールツァイス					
ポスター会場	2F コンベンションホール				9:00～10:00 貼付	10:00～13:00 ポスター・写真展示						13:00-14:30 ポスター討論			14:30～17:30 ポスター・写真展示										
展示	2F コンベンションホール					10:00～17:30 機器展示																				